

# STEM / EDX, TEMによるネオジム磁石評価

超高倍率(nmオーダー)の微細観察 & 分析にご対応致します！

FIB  
(FB2100:日立)

FIB-SEM/EDX/EBSD/STEM  
(NB5000:日立)



(NB5000)

STEM/EDX/EELS  
(HD2300:日立)

TEM  
(H9500:日立)



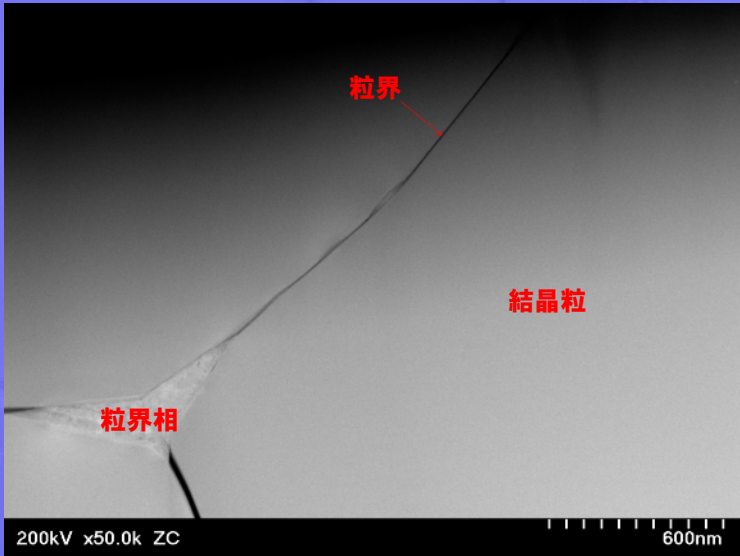
(HD2300)



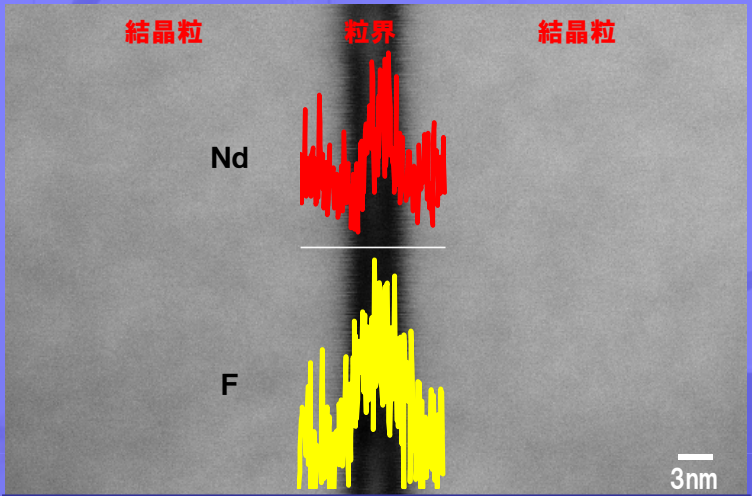
(H9500)

例えば  
こんなことができます！

FIBサンプリング→STEM-EDX分析→TEM観察(ネオジム磁石)

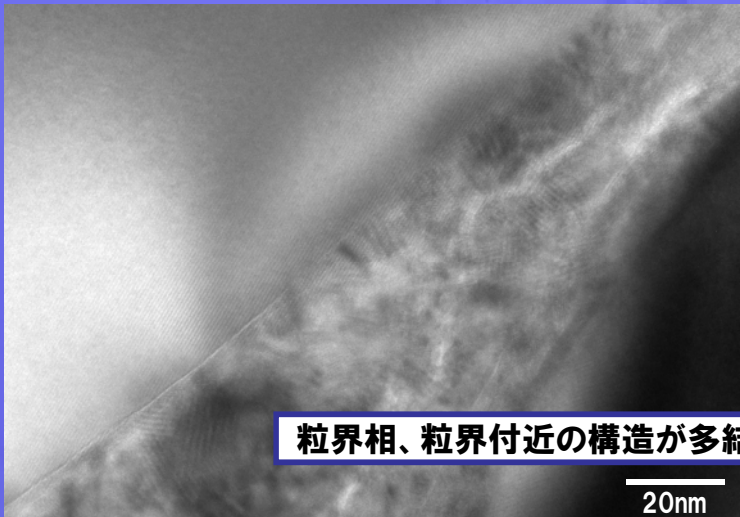


(STEM観察像)

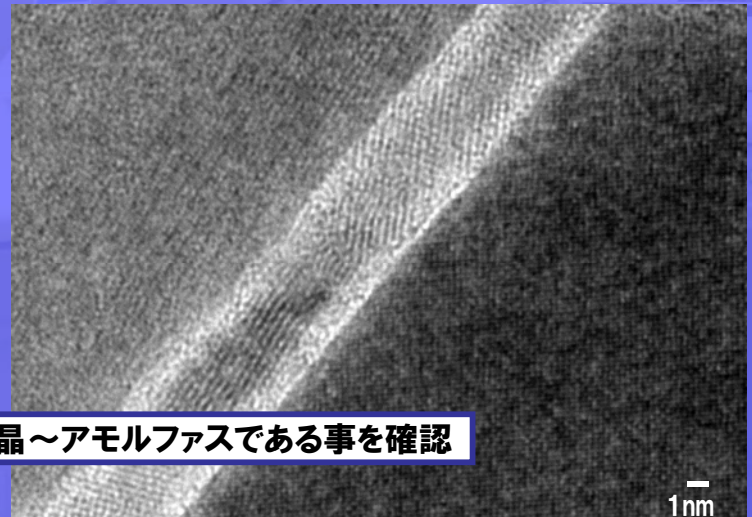


数nm幅の粒界にNd、Fが偏析している事を確認

(粒界付近のSTEM-EDXライン分析結果)



(粒界相付近のTEM観察像)



(粒界付近のTEM観察像)